



SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61000-4-6:2008/IS1:2009
01-september-2009

9`Y_fca U[bYfbUnXfi y`^j cghfØA7Ł!(!* "XY. `DfYg_i gbY]b`a Yf]bY`HΛ b]_Y!
CXdcfbcghdfc]`a cfb`Ua `dc`j cXb]_] ž_]`^] `]bXi WfU`c`fUX]cZY_j Yb bUdc`U†
Hc`a U Yb`Y) "fc _YghUbXUfXU

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields * Interpretation of Clause 5

iteh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6df46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61000-4-6:2007/IS1:2009

ICS:

33.100.20 Imunost Immunity

SIST EN 61000-4-6:2008/IS1:2009 en,fr

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 61000-4-6:2008/IS1:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6df46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6df46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009>



EN 61000-4-6/IS1

Interpretation Sheet 1

EN 61000-4-6:2007

English version

Foreword

This Interpretation Sheet to the European Standard EN 61000-4-6:2007 was prepared by the Interpretation Panel of the Technical Committee CENELEC TC 210, Electromagnetic compatibility (EMC). The text of the draft was submitted to the Unique Acceptance Procedure and was approved by CENELEC on 2008-11-14.

Clause 5 Test levels

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Table 1 – Test levels

[SIST EN 61000-4-6:2008/IS1:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6d46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009)

Question:

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6d46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009>

How to apply the test levels ?

Interpretation:

The test levels are to be applied as stated in Table 1, or as defined in the product standard, without any increase to take into account uncertainties in the setting of the output level at the EUT port of the coupling device. The test generator shall be adjusted to produce the nominal value of U_{mr} as defined in 6.4.1 of the standard.

Validity:

This interpretation remains valid until an amendment or updated standard dealing with this issue is published by CENELEC.

February 2009



Feuille d'Interprétation 1

EN 61000-4-6:2007

Version française

Avant-propos

La présente feuille d'interprétation concernant la Norme Européenne EN 61000-4-6:2007 a été préparée par le Comité d'interprétation du comité technique TC 210 du CENELEC, Compatibilité électromagnétique (CEM). Le texte du projet a été soumis à la procédure d'acceptation unique et a été approuvé par le CENELEC le 2008-11-14.

Article 5 Niveaux d'essai

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Tableau 1 – Niveaux d'essai

[SIST EN 61000-4-6:2008/IS1:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6df46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009)

Question:

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02f6df46-dfb0-4472-90ed-6894bdbb30bb/sist-en-61000-4-6-2008-is1-2009>

Comment appliquer les niveaux d'essai ?

Interprétation:

Les niveaux d'essai doivent être appliqués comme indiqué dans le Tableau 1, ou tel que défini dans la norme de produit, sans aucune augmentation en vue de prendre en compte les incertitudes dans le réglage du niveau de sortie au niveau de l'accès EST du dispositif de couplage. Le générateur d'essai doit être ajusté pour obtenir la valeur nominale de U_{mr} telle que définie au 6.4.1 de la norme.

Validité:

Cette interprétation demeure valable tant qu'un amendement ou une norme actualisée traitant de cette question n'a pas été publiée par le CENELEC.

Février 2009